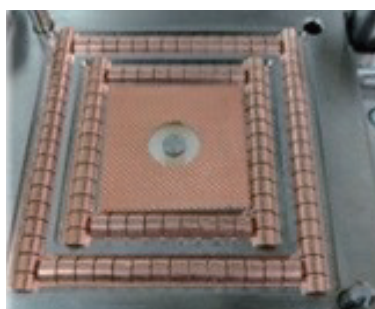


GHz KEC法シールド効果測定装置

(JSE-KEC6G)



■ 用途

シートまたはフィルム状の試料がもつ GHz帯のシールド性能評価を行うことができます。

■ 特徴

GHz KEC法によるシールド材料の性能評価が可能です。

1GHz～6GHzの広い周波数帯を1台で測定可能です。

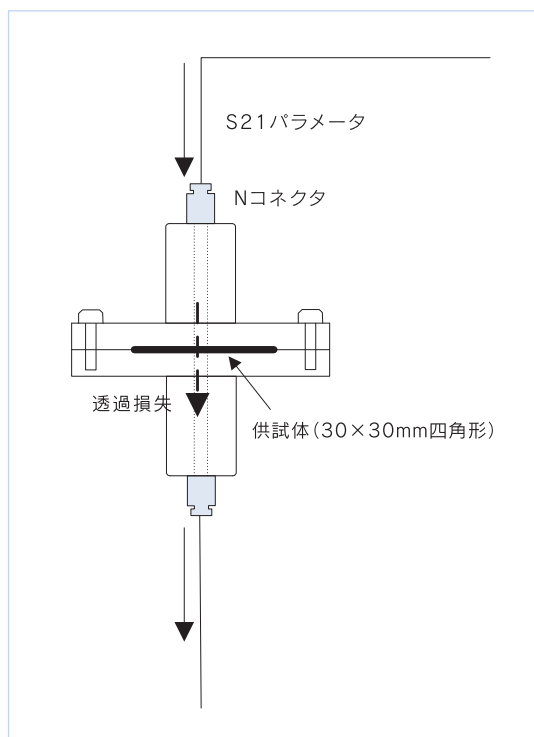
小型試料での測定が可能です。
測定試料の大きさは30mm角程度から50mm角程度までの評価が可能です。

仕様

JSE-KEC6G型シールド効果測定装置	
準拠規格 / 測定法	GHz KEC法
周波数レンジ	1GHz～6GHz
最大入力レベル	受信機の安全入力レベルに依存
ダイナミックレンジ	通過損失、入力レベル及び受信機の測定限界に依存
入出力接栓	N型メス (50Ω)
試料寸法	約30mm角～50mm角 厚さ10μm以上1mm以下
寸法・仕上	外寸法: W300×D350×H320 (突起物除く) 重量: 約20kg 本体: 鉄・SS400ニッケル鍍仕上 基部: アルミ・アルマイト仕上 (黒)
機 構	ホイールハンドル式締付け
付属品	ブラインドプレート※1: 1枚 (銅板・2mm厚)

※上記仕様以外についてもお問い合わせください。

透過損失S21 測定方法



1. 同軸管プレートを対向させて、接合部に試料を挿入しない状態にセットし、ハンドルを操作して密着させます。
2. ネットワークアナライザを接続し、希望の周波数でS21モードにてスルーレスポンス校正を実行します。
(入出力方向の区別はありません。)
3. その手順が終了しましたら上側の同軸管プレートを一旦外し、試料をセットします。ハンドルを操作し同軸管プレート同士を強く密着させてください。
4. Logmagフォーマットで表示された数値がシールド測定値となります。SGとスペアナによる測定では試料非挿入時(P1)と挿入時(P2)のレベル差から透過損失(SE)を求めます。

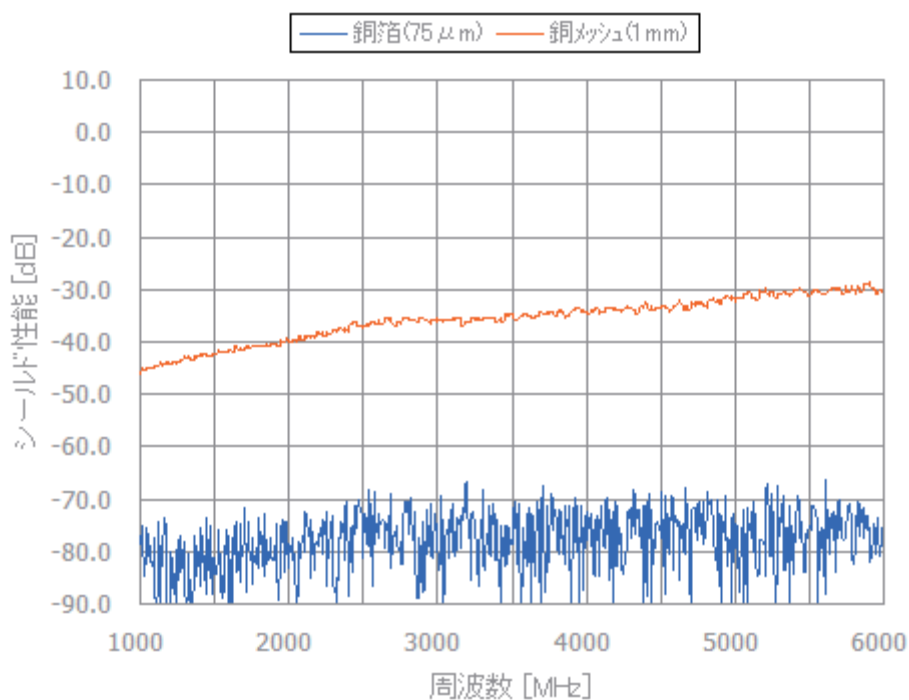
$$SE = P1 - P2 \text{ [dB]}$$

試料寸法：最小30x30mm 程度の大きさ 厚さ10μm～1mm以下

※1 試料は同軸管内径20mmに対して、十分にカバーできる大きさが必要です。

※2 締付けが不十分な場合、測定結果が不安定になることがあります。

関連製品



◇本装置は平成26年9月26日に特許を取得しております。(特許第5619265号)

日本シールドエンクロージャ株式会社

Japan Shielded Enclosures Co.,LTD.

□ 本社・工場	〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4-11-12	TEL:06-6998-7771
□ 東京営業所	〒111-0052 東京都台東区柳橋2-6-2-204	TEL:03-5820-0540
□ 横浜営業所	〒224-0041 横浜市都筑区仲町台1-28-7-304	TEL:045-530-3476



<https://www.jse-emc.co.jp>